

证书号第7396425号



专利公告信息

发明专利证书

发明名称：一种基于反向场追踪的透镜天线及其台阶厚度的设计方法

专利权人：北京理工大学

地址：100081 北京市海淀区中关村南大街5号

发明人：高翔;李焕新;乔丹;陈自如;刘珩;卜祥元;安建平

专利号：ZL 2024 1 0044289.0

授权公告号：CN 117913540 B

专利申请日：2024年01月12日

授权公告日：2024年09月24日

申请日时申请人：北京理工大学

申请日时发明人：高翔;李焕新;乔丹;陈自如;刘珩;卜祥元;安建平

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

申长雨

